ADHESIVE POLYIMIDE SHEET AND PROCESS FILM FOR POLYIMIDE

Publication number: JP9263734

Publication date: 1997-10-07

Inventor: UMEHARA NORITO (JP); AMAGAI MASAZUMI (JP); KOBAYASHI MAMORU (JP); EBE KAZUYOSHI (JP)

Applicant: TEXAS INSTRUMENTS JAPAN (JP); LINTEC CORP

(JP)

Classification:

- International: C09J7/02; C09J179/08; H01L21/301; H01L21/52; C09J7/02; C09J179/00; H01L21/02; (IPC1-7):

C09J7/02; C09J7/02; H01L21/301; H01L21/52

- european:

Application number: JP19970008600 19970121

Priority number(s): JP19970008600 19970121; JP19960008049 19960122

Report a data error here

Abstract of JP9263734

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an adhesive polyimide sheet which is suitable for dicing and die bonding and can produce a semiconductor device scarcely allowing package cracks to occur and to provide a process film for polyimide. SOLUTION: This sheet 1 comprises a process film 2 for polyimide, the film having a surface tension lower than 40dyn/cm, and an adhesive polyimide layer 3 formed on the surface of the process film 2. Pref. the process film has an m.p. of 260 deg.C or higher and is esp. pref. formed from a polyethylene naphthalate resin. Pref. the surface of the process film 2 is prefreated with an alkyd release agent.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-263734

(43)公開日 平成9年(1997)10月7日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号 庁内整理番号	FI	技術表示箇所		
C09J 7/02	JHY	C 0 9 J 7/02	JHY JKD		
	JKD				
	JKL				
H01L 21/52		H01L 21/52	H01L 21/52 E		
21/301		21/78	M		
		審查請求 未請求	耐水項の数8 OL (全 6 頁)		
(21)出顧番号	特願平9-8600	(71)出闢人 390020	390020248		
		日本テ	キサス・インスツルメンツ株式会社		
(22)出顧日	平成9年(1997)1月21日	東京都	港区北青山3丁目6番12号 青山富		
		士ピル			
(31)優先権主張番号	特顧平8-8049	(71)出頭人 000102	980		
(32)優先日	平8 (1996) 1 月22日	リンテ	ック株式会社		
(33)優先権主張国	日本(JP)	東京都	板橋区本町23番23号		
		(72)発明者 梅 原	則人		
		大分県	速見郡日出町大字川崎宇高尾4260		
		日本テ	キサス・インスツルメンツ株式会社		
		日出工	場内		
		(74)代理人 弁理士	鈴木 俊一郎		
			最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】 ポリイミド接着シートおよびポリイミド用工程フィルム

(57) 【要約】

【課題】 ダイシング・ダイボンディングに好適で、パッケージクラックの発生しにくい半導体装置を製造しう るポリイミド接着シートならびにポリイミド用工程フィ ルムを提供すること。

【解決手段】 本発明に係るポリイミド接着シートは、 要面張力が40分か/cm未満のポリイミド用工程フィルム と、該工程フィルム数面に形成されたポリイミド系検 着剤層とからなることを特徴としている。ここで、上記 ポリイミド用工程フィルムの融点が260℃以上である。 とが好まして、特にポリエチレンプタレート樹脂か らなることが好ましい。また、上記ポリイミド用工程フィルムの表面は、アルキッド系刺離剤にて刺離処理され てなることが好ましい。





FP03-0042-00US " 0042-01US " 0044-00US

" 0046-dous " 0270-dous " 0278-0045

<u>06.10.03</u>

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面張力が4 Odyn/cm未満のポリイミド 用工程フィルムと、該工程フィルム表面上に形成された ポリイミド系接着剤層とからなることを特徴とするポリ イミド接着シート。

【請求項2】 前記ポリイミド用工程フィルムの融点が 260℃以上であることを特徴とする請求項1に記載の ポリイミド接着シート。

【請求項3】 前記ポリイミド用工程フィルムが、ポリエチレンナフタレート樹脂からなることを特徴とする請 10 求項2に記載のポリイミド接着シート。

【請求項4】 前記ポリイミド用工程フィルムの表面 が、アルキッド系製脂剤にて製離処理されてなることを 特徴とする請求項1~3に記載のポリイミド接着シー ト

[請求項5] ポリイミド系接着剤を成膜、支持するためのポリイミド工程フィルムであって、表面張力が40 はyn/cm未満であることを特徴とするポリイミド用工程フィルム。

【請求項6】 融点が260℃以上であることを特徴と 20 する請求項5に記載のポリイミド用工程フィルム。

【請求項7】 前記ポリイミド用工程フィルムが、ポリエチレンナフタレート樹脂からなることを特徴とする請求項6に記載のポリイミド用工程フィルム。

【請求項8】 表面が、アルキッド系剝離剤にて剝離処理されてなることを特徴とする請求項5~7に記載のポリイミド用工程フィルム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の技術分野】本発明は、ポリイミド接着シートな 30 らびにポリイミド用工程フィルムに関し、特に複数の半導体集積回路が形成されたシリコンウェハをダイシング し、個々の半導体集積回路、即ち10チップ(チップまたはダイとも言う)とし、さらにそれら10チップをパッケージ用リードフレーム等に搭載する工程において使用されるポリイミド接着シートならびにポリイミド用工程フィルムに関する。

[0002]

【発明の技術的背景】シリコン、ガリウムヒ素などの半 郷体ウェハは大径の状態で製造され、このウェハはIC 40 チップに切断分離(ダイシング)された後に次の工程で あるパッケージ用リードフレームにICチップを載置す るダイボンディング工程(マウントエ程とも買う)に移 されている。

【0003】ダイポンディング工程において、ピックアップされたICチップは、リードフレームのICチップ 活数師(マウント部)に塗布されたエボキシ系接着剤、ポリィミド系接着剤、銀ペーストなどの粘液状で供給されるICチップ接滑用接着剤を介して固定され、その後ワイヤーボンディング工程 樹脂モールド工程を経て半 50

導体装置が製造されている。しかしながら、このような 液状接着剤の塗布では、I C テップが非常に小さな場合 には、適量の接着剤を助ーに塗布することが困難であ り、I C チップから接着剤がはみ出したり、あるいは I C チップが大きい場合には、接着剤が不足するなど、充 分を対策力を有するように接着を行うことができないな どという問題点があった。

【0004】近年、半導体チップの集積度は増加する傾向にあり、これに伴い、チップサイズは大面積化し、また配線は破絶化、多俗化しつつある。その一方で、プリント配線板への実装を高密度に行えるように、チップを収納するパッケージは小型化、薄彩化する傾向にある。 これら大面積の薄形パッケージは、光楽のものと比較して、耐熱衝撃性や耐熱湿性に劣り、装面実装工程においてパッケージクラックを発生しやすいという問題があった。

【0005】一方、リードフレームへのICチップ接着 用に耐熱性の優れたポリイミド協語を用いたフィルム接 着剤が提案され、半導体装置の耐久性を向上することが 報告されている。またこのようなICチップ接着用の終 着剤を基材フィルムに刺離可能に積層したダイシング・ ダイポンディング兼用のダイシングシートが提案されて いる。

[0006] しかし、ポリイミド樹脂を用いたフィルム 接着剤は、上配のようなダイシング・ダイポンディング 工程に適用可能なものは存在せず、チップの保持性、転 写性に不充分であった。

[0007]

【発明の目的】本発明は、上記のような従来技術に鑑みてなされたものであって、ダイシング・ダイポンディングに好適で、パッケージクラックの発生しにくい半導体装置を製造しうるポリイミド接着シートならびにポリイミド用工程フィルムを提供することにある。

[0008]

【発明の概要】本発明に係るポリイミド接着シートは、表面張力が40dyn/cm未満のポリイミド用工程フィルムと、該工程フィルム最大の高いまで、また、また、また、また、また、また、また、よいで、また、上記ポリイミド用工程フィルムの融点が260℃以上であることが好ましく、特にポリエチレンナフタレート樹脂からなることが好ましい。また、上記ポリイミド用工程フィルムの表面は、アルキッド系剝離剤にて剝離処理されてなることが好ましい。

【〇〇〇〇】 本発明に係るポリイミド用工程フィルムは、ポリイミド系接着剤を成譲、支持するために用いられ、その表面張力が40切が(の未満であることを特徴としている。ここで、上記ポリイミド用工程フィルムの融点が260℃以上であることが許ましく、特にポリエテレンナフタレート樹脂からなることが許ましい。また、上記ポリイミド用工程フィルムの表面は、アルキッド系

剥離剤にて剥離処理されてなることが好ましい。 【OO10】

【発明の具体的説明】以下、本発明に係るポリイミド接 着シートおよびポリイミド用工程フィルムについて、具 体的に説明する。

【0011】本発明に係るポリイミド接着シート1は、図1に示すように、ポリイミド用工程フィルム2と、前 記ポリイミド用工程フィルム2上に形成されたポリイミ ド系接着剤層3とからなる。なお、本発明のポリイミド 接着シート1の使用前に、ポリイミド系接着剤層3を保 10 護するために、シート1の上面に離型フィルムを積層し ておいてもよい。

【0012】本発明に係るポリイミド接着シート1の形状は、テープ状、ラベル状などあらゆる形状をとりう。ポリイミド接着シートを構成するポリイミド用工程フィルム2の表面張力は、40dm/cm未満、好ましくは30~40dm/cmであり、このような表面張力を有する表面に後述するポリイミド系接着利層3が形成されてなる。表面張力が30~40dm/cmの範囲では、ポリイミド系接着利層3のポリイミド用工程フィルム2から転20 写性と、ダイシングに用いた際のチップ保持性に特に優れる。また、ポリイミド用工程フィルム2は耐熱性の樹脂からなることが好ましく、前配樹脂の融点は好ましくは260℃以上、さらに好ましくは260℃のよりのでで、特味に好ましくは260℃のよりでである。

【0013】 このようなポリイミド用工程フィルム2としては、具体的には、ポリエーテルイミドフィルム、ポリエーテルイミドフィルム、ポリエーテルイミドフィルム、ポリアラミドフィルム、ポリアーテルケトンフィルム、ポリアーテル・エーテルケトンフィルム、ポリフェ 30 ニレンサルファイドフィルム、ポリイニチルペンテンー1) フィルム等が用いられる。また、ポリイミド用工程フィルム 2 はこれらフィルムの積層体であってもよい。これらの中でも特に好ましくはポリエテレンナフタレートフィルムが用いられる。

【0014】ポリイミド用工程フィルム2の膜厚は、その材質にもよるが、通常は10~300μπ程度であり、 リ、好ましくは16~100μπ程度である。また、前 記の表面張力値を付与するためには、ポリイミド用工程 40 フィルム2の片面に離型処理を施しておき、この離型処理面に、ポリイミド系接着剤層3を設けることが好まし い。

【0015】このような難型処理に用いられる離型剤としては、アルキッド系、シリコーン系、フッ素系、不飽和ポリエステル系、ポリオレフィン系、ワックス系等が用いられるが、特にアルキッド系、シリコーン系、フックス系等が東系の離型剤が耐熱性を有するので好ましい。特にポリイミド用工程フィルムの基材への密着性が高く、表面張力が調製しやすいため、アルキッド掛脚が好ましい。

【0016】上記の難型刺を用いてポリイミド用工程フィルム2の表面を構型処理するためには、離型剤をそのまま無溶剤で、または溶剤や駅やエマルション化して、グラビアコーター、メイヤーバーコーター、エアナイフコーター、ロールコーター等により送売して、常温または加熱あるいは電子機硬化させたり、ウェットラミネーションやドライラミネーション、熱溶融ラミネーション、溶脱神田ラミネーション、共押出加工などで積層体を形成すればよい。

【0017】ポリイミド接着シート1を構成するポリイミド系接着利層3に用いられるポリイミド系積指は、ポリイミド樹脂自体と、ポリイミド樹脂の前駆体とを包含する。ポリイミド樹脂は、側位または主顔にイミド結合を有する。またポリイミド樹脂が軽なとは、最終的な接着工程で、上配のポリイミド樹脂を与えるものをいう。このようなポリイミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリアニドイミド樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリースミドイミド樹脂、ポリエーテルイミド樹脂・ポリースミドイミド樹脂・ボリエーテルイミド樹脂・ボリースミド・オンバーンドロキナゾリンジオンイミド樹脂等が挙げられ、これらの樹脂単大の一般は単大の一般によりイミド樹脂が好きしい。これらの中でも特にポリイミド樹脂が好ましい。

【0018】ポリイミド系樹脂の分子量は、好ましくは 10,000~1,000,000、特に好ましくはち 0,000~100、00日程度である。上記のような ポリイミド系樹脂には、反応性官能基を有しない熱可塑 性ポリイミド系樹脂と加熱によりイミド化反応する熱硬 化性のポリイミド樹脂が存在するが、そのいずれであっ でもよい。熱硬化性ポリイミド樹脂を使用する場合は 半硬化物(いわゆる日ステージ)の樹脂を用いて仮検さ

半硬化物(いわゆるBステージ)の樹脂を用いて仮接着 した後、加熱硬化して接着剤層をポリイミド化し、接着 工程を完了させる。

【0019】また、ポリイミド系樹脂に、他のポリマーやオリゴマー、低分子化合物を添加したポリイミド系接 増剤を用いてもよい。たとえば、エポキシ樹脂、アミド 樹脂、ウレタン樹脂、アミド酸樹脂、アクリル樹脂、シリコーン樹脂などの各種ポリマーやオリゴマー; トリエ タノールアミンやα、ωー(ピス3-アミノブロピル) ポリエチレングリコールエーテルなどの合選素有機化合 物などが添加剤として挙げることができる。

【○○2○】また、ポリイミド系接着剤組成物を調製する際に、上記各成分を均一に溶解・分散させることが可能な溶媒を用いることもできる。このような溶媒としては、上記材料を均一に溶解・分散できるものであれば特に限定はなく、たとえばジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ジエチレングリコールジメチルエーテル、トルエン、ペンゼン、キシレン、メチルエチルケトン、テトラヒドロフラン、エチルセロソルブ、ジオキサン、シケロペンタノン、シクロペキサンン等を挙げることがで

き、1種類のみを用いてもよいし、2種類以上を混合し て用いてもよい。

【0021】ポリイミド系接着剤層3の膜厚は、好まし くは1~50川m程度であり、特に好ましくは5~20 μ m程度である。本発明のポリイミド接着シート1に は、100~300℃、好ましくは120~150℃程 度の加勢、および1~1 Okg/cm2 好ましくは1~4kg /cm² 程度の加圧条件下でウェハを熱圧着可能であり、 勢圧着により、ウェハに対し好ましくは100g/25 mm以上、特に好ましくは400g/25mm以上の接 10 着力を有するようになる。

【0022】次に本発明に係るポリイミド接着シート1 の主な使用方法について説明する。まず、図2に示すよ うに、別途用意した粘着シートや両面粘着シートなどの 接着手段4により、ポリイミド接着シート1をリングフ レーム5に固定し、シリコンウェハ6の一面をポリイミ ド接新剤層3上に熱圧着し固定する。熱圧着の条件は上 記のとおりである。なお、ウェハ6をポリイミド接着剤 層3上に熱圧着する工程は、ポリイミド接着シート1を リングフレーム5に固定する前に行ってもよく、固定後 20 に行ってもよい。次いで、ダイシングソーなどの切断手 段を用いて、上記のシリコンウェハ6を切断しICチッ プを得る(図3参照)。この際の切断深さは、シリコン ウェハ6とポリイミド系接着剤層3との厚みおよびダイ シングソーの磨耗分を加味した深さにする。次いでIC チップのピックアップを行うと、切断されたポリイミド 系接着剤層をICチップ裏面に固着残存させてポリイミ ド用工程フィルム2から剝離することができる。この際 のICチップとポリイミド系接着削層との接着力が、ポ リイミド系接着剤層とポリイミド用工程フィルムとの接 30 着力よりも強く、ポリイミド系接着創層を I Cチップの 片面に固着残存させてポリイミド用工程から剝離するこ とができる.

【0023】このようにしてポリイミド系接着剤層が固 潜されている!Cチップをリードフレームに載置する。 リードフレームは I Cチップを載置する前に加熱するか 載置直後に加熱される。加熱温度は、通常は100~3 00℃、好ましくは150~250℃であり、加熱時間 は、通常は1秒~60分、好ましくは1秒~1分であ る。このような加熱により、ポリイミド系樹脂を溶融ま 40 たは硬化させ、ICチップとリードフレームとを強固に 接着することができる。

【0024】なお、本発明のポリイミド接着シートは、 上記のような使用方法の他、半導体化合物、ガラス、セ ラミックス、金属などの接着に使用することもできる。 本発明のポリイミド接着シートによれば、ウェハ回路面 を汚染することなく容易にウェハ薬面に接着創層を形成 することができ、しかも、比較的低温で加熱圧着するこ とが可能であるため、ウェハが受ける熱的、機械的ダメ

お、本発明のポリイミド接着シートは、上記の他にも、 たとえばダイパッドの接着剤膜、封止樹脂とチップ裏面 の密着向上膜、パッシベーション膜、層間絶縁膜、α線 遮蔽障、液晶配向膜、フォトレジスト障、プリント基板 保護膜、パターン形成膜、X線露光マスキング膜等の成 隙に使用することができる。

【0025】さらに、本発明は、前記ポリイミド接着シ ートに特に好適に用いられるポリイミド用加工フィルム を提供することも目的としている。すなわち、本発明に 係るポリイミド用工程フィルムは、ポリイミド系接着剤 を成膜、支持するために用いられ、その表面張力が40 dvn/cm未満であることを特徴としている。ここで、上記 ポリイミド用工程フィルムの融点が260℃以上である ことが好ましく、特にポリエチレンナフタレート樹脂か らなることが好ましい。また、上記ポリイミド用工程フ ィルムの表面は、アルキッド系剝離剤にて剝離処理され てなることが好ましい。本発明のポリイミド用工程フィ ルムによれば、工程用フィルムの耐熱性が高いために、 高沸点溶媒を用いているポリイミド系接着創溶液の療

布、高温乾燥工程に対応することができ、容易にポリイ ミド系接着剤を成態することができる等の技術的利点が ある。なお、本祭明のポリイミド加工フィルムは、上記 の他にも、たとえば高沸点溶媒を使用しているその他の 樹脂の成膜等の用途に使用することができる。

[0026] 【発明の効果】本発明によれば、ダイシングの際にはダ イシングテープとして使用することができ、しかも接着 剤としてウェハ裏面にマウントすることができ、リード フレーム等との接辞力に優れ、ダイボンド後に耐熱性、 耐老化性等に優れたポリイミド接着シートを提供するこ とができる。さらに本発明によれば、ポリイミド系接続 剤の使用にあたって原料ロスを低減でき、しかも厚みが 均一な接着剤層を形成することができる。またポリイミ ド接着剤層をウェハに転写するに際して、ウェハが受け る熱的、機械的ダメージを回避することができる。ま た、本発明のポリイミド接着シートを用いることによ り、パッケージクラックを発生しにくい半導体装置を製 造することができる。

【実施例】以下本発明を実施例により説明するが、本発 明はこれら実施例に限定されるものではない。*

[0027]

【0028】なお、以下の実施例および比較例におい て、「パッケージクラック発生率」、「チップ飛散数」 および「チップ剝離力」は次のようにして評価した。 パッケージクラック発生率

ダイシング後、ポリイミド接着シートからチップを取り 出し、リードフレームにマウントし、ボンディング後、 所定のモールド樹脂 (ピフェニル型エポキシ樹脂) で高 圧封止する。175°C、6時間をを要して、その樹脂を ージを回避することができる等の技術的利点がある。な 50 硬化させ、パッケージとして完成させた後、85℃、8

5 %RHの環境下に 1 6 8時間放置する。その後、2 1 5 ℃の V P S (Vapor Phase Soldering) (所要時間: 1 分間) を3 回行い、走査型超音波探傷機ら A T (Scan ning Acoustic Tomography) で封止樹脂のクラックの有 無を検査する。投入検体数に対するクラック発生数の比 率をパッケージクラック発生率とする。

チップ飛散数

各チップサイズにダイシングした後、飛散チップ数 (周 繰の不定形部分を含む)をカウントした。 チップ剝離力

[0029]

【実施例1】アルキッド系刺離剤により刺離処理したポリエトンナフタレートフィルム (厚さ25μm: 融点 272℃、表面張力34分/m) をポリイミド用工程 フィルムとし、この処理面に熱可塑性ポリイミド接着剤のシクロヘキサノン溶液を塗布 (固形分塗布厚10μm) し、乾燥(1140℃、3分)してポリイミド接着シートを作成した。

【0030】次いでポリイミド系接着シートを直径 1 2 0mmに打抜加工し、4インチウェハを熱圧着(1 4 0 ℃、30秒)させ、別途用意した粘着シート(軟質ポリ 30 塩化ピニル(100μm)とアクリル系粘着剤(10μ m)の積層体)で、ウェハが圧着されているポリイミド

接着シートをリングフレームに固定した。

【0031】これを公知の方法で、ポリイミド系接着剤 層までフルカットダイシングを行い、10mm×10mmの テップに分割し、ピックアップ、ポンディングおよび! Cモールドをおこなった。

【0032】次いで、上記の手法により「パッケージク ラック発生率」、「チップ飛散数」および「チップ剝離 カ」を測定した結果を衷1に示す。

[0033]

「実施例 2 】 アルキッド系削離剤により削離処理したポリエチレンナフタレートフィルム(厚さ25μm: 融点 2 7 2 ℃、表面張力3 4 4 4 m/cm) に代えてシリコン系剥離剤により剥離処理したポリエチレンナフタレートフィルム(厚さ25μm: 融点 2 7 2 ℃、装面張力3 0 dyn/cm)を用いた以外は、実施例 1 と同様の操作を行った。

【0034】ダイシングの際に、周縁の不定形部分のチップの飛散は起こったが、製品となりうる部分のチップ の飛散は起こったが、製品となりうる部分のチップ の飛散は起きず、ICの製造に支障は無かった。結果を 20 寿1に示す。

[0035]

【実施例3】アルキッド系刺離剤により剥離処理したポリエチレンナフタレートフィルムに代えて、剥離処理を施さないポリ (4-メチルペンテン-1) フィルム (厚さ25µm: 融点235℃、表面張力244yn/cm)を用いた以外は、実施例1と同様の操作を行った。

【0036】ダイシングの際に、周縁の不定形部分のチップの飛散は起こったが、製品となりうる部分のチップ の飛散は起きず、ICの製造に支障は無かった。結果を 表1に示す。

【0037】 【表1】

	チップ飛散数		チップ剝離力		バッケージクラック 発生率
	3 mm 🗀	10mm	3 mm 🗀	10mm	10益告
実施例1	0	0	250	8 4 0	0/15
実施例 2	9	0	180	770	0/15
実施例3	1 2	3	120	610	0/15

【図面の簡単な説明】

【図1】 図1は、本発明に係るポリイミド接着シートの断面図を示す。

【図2】 図2は、ポリイミド接着シートにシリコンウェハを熱圧着し、粘着シートに固定した状態を示す。
【図3】 図3は、シリコンウェハをダイシングしている状態を示す。

40 【符号の説明】

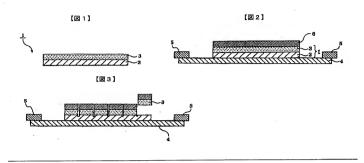
1…ポリイミド接着シート 2…ポリイミド用工程フィルム

3…ポリイミド系接着剤層

4…粘着シート

5…リングフレーム

6…シリコンウェハ



フロントページの続き

(72) 発明者 雨 海 正 純

大分県速見郡日出町大字川崎字高尾4260 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社 日出工場内) (72)発明者 小 林 真 盛

埼玉県北葛飾郡吉川町吉川団地5街区11-

504

(72) 発明者 江 部 和 義

埼玉県南埼玉郡白岡町下野田1375-19